

Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии X

Полуавтоматическая станция для измерения пластин серии X

Цена:

Цена по запросу

Описание

Полуавтоматические зондовые станции серии X

Полуавтоматические зондовые станции серии X предназначены для тестирования пластин диаметром до 300 мм, позволяют проводить измерения при температурах от -60 °С до 300 °С. Возможность управления зондовой станцией с помощью команд SCPI позволяет автоматизировать процесс измерений и минимизировать человеческий фактор при выполнении измерений

Достоинства моделей серии X:

- Тестирование светодиодов/фотодиодов/лазерных диодов (интенсивность излучения/длина волны)
- Измерение вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик тестируемых материалов/изделий
- СВЧ измерения (до 300 ГГц)
- Измерения в широком диапазоне температур
- Скорость перемещения держателя подложек до 70 мм/с

Модель	X6/X8/X12	
Держатель подложек	Диапазон перемещения XY	350mm*365mm
	Разрешение XY	0.1мкм
	Повторяемость XY	$\cong \pm 1$ мкм
	Скорость перемещения XY	$\cong 70$ мм/с
	Z Диапазон перемещения	20мм
	Z Разрешение	0.1мкм

Z Повторяемость	$\leq \pm 1 \text{ мкм}$	
Z Скорость перемещения	$\leq 20 \text{ мм/с}$	
Температурный диапазон	Диапазон	-60°C-300°C
	Стабильность	0.1°C
	Разрешение	0.01°C
Оптическая система с многократным увеличением	Микроскоп с трехскоростным увеличением 15:1, может одновременно показывать изображения с низким, средним и высоким увеличением, легко наводить иглу	
Широкое применение	Поддержка тестирования SiC/GaN пластин, тестирование мощных пластин Сменная конструкция держателя пластин для тестирования различных пластин	
Функции программного обеспечения	① Поддержка полуавтоматического управления (возможен ручной тест или переход на автоматический)	
	② Автоматическое выравнивание пластин	
	③ Автоматическое измерение размера матрицы	
	④ Автоматическое картирование пластин и удаленный доступ к данным	
	⑤ Свободное управление и программирование входных и выходных параметров	
	⑥ Быстрая интеграция нескольких тестеров	
	⑦ Автоматическая радиочастотная калибровка одной кнопкой, функция автоматической очистки иглы	
	⑧ Поддержка тестирования по одной точке и непрерывного тестирования	

⑨Автоматическое
сохранение
данных,
синхронная
обработка
данных

⑩Классификация
результатов
тестирования и
отображение их
разным цветом
на карте
пластин

Контроль
предельной
скорости и
блокировка
безопасности